Определение индекса Хирша (h-index) ученого с использованием БД «Scopus»

Для корректной работы в БД Scopus следует использовать последние версии интернет-браузеров (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer).

! Индекс Хирша рассчитывается системой автоматически на основании тех документов, которые обрабатываются в БД Scopus, а именно журнальных статей и материалов конференций, книг – частично.

Процесс определения h-index осуществляется в два этапа: сначала проводится поиск всех публикаций ученого, затем устанавливается индекс Хирша.

В том случае, если вариант фамилии автора только один, используют режим поиска «Author search», если вариантов больше – то «Document search».

Порядок выполнения

Author search

1. Зайти на сайт по адресу: <u>http://www.scopus.com</u> (доступ лицензионный)

2. Выбрать режим поиска автора «Author search».

3. Ввести фамилию автора по предлагаемому образцу.

4. Отметить необходимость *точного соответствия* результатов заданным параметрам поиска («Show exact matches only»).

5. Оставить предметные рубрики («Subject Areas»), которые соответствуют тематике искомого автора.

6. Запустить поиск (<Search>).

7. Отметить в предложенном системой списке искомого автора.

Далее возможны два варианта (А и Б).

8А. С 2014 г. в БД Scopus h-index ученого отражается в авторских профилях («Author Identifier»). Для того чтобы попасть в «Author Identifier» нужно нажать на активную ссылку фамилии автора.

Примечание. В этом случае при расчете h-index учитываются публикации, начиная с 1995 г.

8Б. Для определения более полного индекса Хирша нажать кнопку <«Show documents>.

9Б. Отметить публикации, цитируемость которых больше «0», для чего:

- изменить признак сортировки («Sort on»), нажав на активную ссылку «Cited by» (по цитируемости) в правой верхней части экрана;
- для удобства просмотра увеличить порцию документов, выдаваемых на страницу («Display... results per page»), в левой нижней части экрана;
- просмотреть документы на каждой странице и отметить те из них, которые имеют цитируемость больше «0».

10Б. Нажать кнопку <View citation overview> для определения индекса Хирша (показатель hindex располагается в верхней части экрана) (см. Приложение).

Document search

- 1. Зайти на сайт по адресу: <u>http://www.scopus.com</u> (доступ лицензионный)
- 2. Выбрать режим поиска «Document search».
- 3. Установить поисковое поле «Authors».
- 4. Ввести первый вариант фамилии автора по образцу, например: vlasov, v. v.
- 5. Вызвать дополнительное поисковое поле, нажав кнопку <Add search field>.

6. Установить поисковое поле «Authors», ввести другой вариант фамилии автора, например: vlassov, v.v.

- 7. Установить между поисковыми полями логический оператор OR.
- 8. При необходимости, повторить пп. 5, 6, 7.
- 9. Запустить поиск (кнопка <Search>).

Примечание. При этом поиске результаты могут содержать нерелевантные документы.

10. Просмотреть найденные публикации и отметить релевантные (принадлежащие данному ученому), имеющие цитируемость больше «0» (! не более 2000 записей), для чего:

- изменить признак сортировки («Sort on»), нажав на активную ссылку «Cited by» (по цитируемости), в правой верхней части экрана;
- для удобства просмотра увеличить порцию документов, выдаваемых на страницу («Display ... results per page»), в левой нижней части экрана;
- просмотреть документы на каждой странице и отметить те из них, которые имеют цитируемость больше «0».

11. Нажать кнопку <View citation overview> для определения индекса Хирша (показатель h-index располагается в верхней части экрана).

copus									Register	Login 🛛
earch Alerts My list Settings						Live	e Chat I	Help and	Contact	Tutoria
itation overview This is a overview of citations for the	documents	you select	ed						Export	🖳 🖳 Prin
105 cited documents 🕂 Save these documents to My list										
Document h-index : 14 Scopus does not have complete citation informat	tion for articles	published be	fore 1996	. 💌 Vie	w />grap	0				
00 2010 2011 Years		2012		2013		Date rar	nge: 20 ude self ci ude Citatio data for th on table b	to tations of all au ons from books is graph and elow.	2013	ate
Sort on: Date (newest) Citation count (descending)		Citatio	ons	2010	2011	2012	2013	Subtotal	>2013	Total
Documents Sart on: Date (newest) Citation count (descending)	Total	Citatio <2009 648	2009 46	2010 49	2011 55	2012 43	2013	Subtotal 240	>2013 28	Total 916
Sort on: Date (newest) Citation count (descending)	Total	Citatio <2009 648 204	2009 46 11	2010 49 4	2011 55 15	2012 43 11	2013 47 7	Subtotal 240 48	>2013 28 1	Total 916 253
Sort on: Date (newest) Citation count (descending) 1 1 2 A new low voltage fast SONOS memory with high-k dielectric	Total 1989 2003	Citation (2009) (200	2009 46 11 10	2010 49 4 13	2011 55 15 3	2012 43 11 2	2013 47 7 4	Subtotal 240 48 32	>2013 28 1 2	Total 916 253 60
Sort on: Date (newest) Citation count (descending) 1 1 2 A new low voltage fast SONOS memory with high-k dielectric 3 Reflection electron microscopy study of structural transform	Total 1989 2003 1990	Citatio <2009 648 204 26 43	2009 46 11 10 2	2010 49 4 13 1	2011 55 15 3 2	2012 43 11 2 2	2013 47 7 4 1	Subtotal 240 48 32 8	>2013 28 1 2	Total 916 253 60 51
Sort on: Date (newest) Citation count (descending) 1 1 7 2 A new low voltage fast SONOS memory with high-k dielectric 3 Reflection electron microscopy study of structural transform 4 UHV REM study of the anti-band structure on the vicinal Si(1	Total 1989 2003 1990 1994	Citatio <2009 648 204 26 43 38	2009 46 11 10 2 1	2010 49 4 13 1	2011 55 15 3 2 3	2012 43 11 2 2 2 1	2013 47 7 4 1 1	Subtotal 240 48 32 8 6	>2013 28 1 2	Total 916 253 60 51 44
Documents Sort on: Date (newest) Citation count (descending) 1 1 1 2 A new low voltage fast SONOS memory with high-k dielectric 3 Reflection electron microscopy study of structural transform 4 UHV REM study of the anti-band structure on the vicinal Si(1 5 Reflection electron microscopy study of clean Si(111) surfac	Total 1989 2003 1990 1994 1991	Citatio <2009 648 204 26 43 38 33	2009 2009 46 11 10 2 1 1 1	2010 49 4 13 1 1	2011 55 15 3 2 3 3 2	2012 43 11 2 2 1 1 2	2013 47 7 4 1 1 2	Subtotal 240 48 32 8 6 8	>2013 28 1 2	Total 916 253 60 51 44 41
Documents Bort on: Date (newest) Citation count (descending) 1 1 1 2 A new low voltage fast SONOS memory with high-k dielectric 3 2 4 UHV REM study of the anti-band structure on the vicinal Si(1 5 Reflection electron microscopy study of clean Si(111) surfac 8 HgCdTe epilayers on GaAs: Growth and devices	Total 1989 2003 1990 1994 1991 2003	Citatio <2009 648 204 26 43 38 33 15	2009 46 11 10 2 1 1 5	2010 49 4 13 1 1 1 5	2011 55 15 3 2 3 2 3 2 1	2012 43 11 2 2 1 2 2 4	2013 47 7 4 1 1 2 5	Subtotal 240 48 32 8 6 8 8 8 20	>2013 28 1 2	Total 916 253 60 51 44 41 38
Documents Sort on: Date (newest) Citation count (descending) 1 1 2 A new low voltage fast SONOS memory with high-k dielectric 3 Reflection electron microscopy study of structural transform 4 UHV REM study of the anti-band structure on the vicinal Si(1 5 Reflection electron microscopy study of clean Si(111) surfac 6 HgCdTe epilayers on GaAs: Growth and devices 7 Extended defects formation in Si crystals by clustering of i	Total 1989 2003 1990 1994 1994 1991 2003 1999	Citatio <2009 648 204 26 43 38 33 15 26	2009 46 11 10 2 1 1 5 1	2010 49 4 13 1 1 5 3	2011 55 15 3 2 3 2 2 1 1 2	2012 43 11 2 2 1 2 1 2 4 1	2013 47 7 4 1 1 2 5 2	Subtotal 240 48 32 8 6 8 8 6 8 20 9	>2013 28 1 2 3	Total 916 253 60 51 44 41 38 35
Documents Bort on: Date (newest) Citation count (descending) 1 Transformations on clean Si(111) stepped surface during subl 2 A new low voltage fast SONOS memory with high-k dielectric 3 Reflection electron microscopy study of structural transform 4 UHV REM study of the anti-band structure on the vicinal Si(1 5 Reflection electron microscopy study of clean Si(111) surfac 6 HgCdTe epilayers on GaAs: Growth and devices 7 Extended defects formation in Si crystals by clustering of i 8 Peculiarities of step bunching on Si(001) surface induced by	Total 1989 2003 1990 1994 1991 2003 1999 1998	Citatio <2009 648 204 26 43 38 33 33 15 26 27	2009 46 11 10 2 1 1 5 1	2010 49 4 13 1 1 5 3 1	2011 55 15 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2	2012 43 11 2 2 1 2 4 4 1 1	2013 47 7 4 1 1 2 5 2 2 2	Subtotal 240 48 32 8 6 6 8 20 9 9 4	>2013 28 1 2 3	Total 916 253 60 51 44 41 38 35 35

Приложение